

ВЛИЯНИЕ СИЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ПЛАЗМЕННЫЕ ВОЛНЫ В 2D СВЕРХСТРУКТУРАХ

С.Ю. Глазов, С.В. Крючков

*Волгоградский государственный педагогический университет,
400131, г. Волгоград, пр. Ленина, 27, 72-22-21, sed@fizmat.vspu.ru*

Исследовано влияние сильного постоянного электрического поля на плазменные волны в двумерном электронном газе со сверхструктурой с учетом процессов переброса. В случае высоких температур ($\Delta \ll T$, Δ – ширина минизоны проводимости, T – температура в энергетических единицах) получено дисперсионное соотношение $\omega(k)$. Показано, что частота плазмонов в сильном электрическом поле зависит от величины напряженности поля и волнового числа осциллирующим образом. Численная оценка показывает, что осцилляции могут проявиться при значениях напряженности электрического поля больших, чем 3×10^3 В/см.

Введение

В последнее время в физике полупроводников активно изучаются новые объекты, содержащие двумерный (2D) электронный газ в системе с периодическим потенциалом. В работе [1] сообщается о создании такой двумерной сверхрешетки при помощи электронно-лучевой литографии и реактивного ионного травления. В [2] изучены шубниковские осцилляции 2D электронов, находящихся в 2D периодическом потенциале с периодом $d = 0.24$ мкм. В [3] показана возможность распространения в 2D сверхструктурах (СС) уединенных электромагнитных волн. В [4] исследована возможность возникновения плазменных колебаний в 2D электронном газе с СС. С другой стороны известно [5], что достаточно сильное постоянное электрическое поле, приложенное вдоль одной из осей СС, приводит к существенному изменению электронного энергетического спектра – так называемому штарковскому квантованию. В этой связи представляется актуальным исследовать влияние сильного постоянного электрического поля на плазменные колебания в 2D СС.

Основная часть

Рассмотрим 2D электронный газ в системе с периодическим потенциалом. Сильное постоянное электрическое поле, удовлетворяющее условию $\Omega\tau \gg 1$ (где τ – время свободного пробега электрона, $\Omega = eEd$ – штарковская частота (здесь и далее $\hbar = 1$), d – период СС, E – напряженность электрического поля), будем описывать зависящим от времени векторным потенциалом $\vec{A}(t) = \{-cEt, 0\}$ (напряженность постоянного электрического поля направлена вдоль оси ОХ). Закон дисперсии электронов в минизоне проводимости в отсутствие электрического поля в приближении сильной связи описывается выражением

$$\varepsilon(\vec{p}) = \Delta - \frac{\Delta}{2} [\cos(p_x d) + \cos(p_y d)], \quad (1)$$

где Δ – полуширина минизоны проводимости; p_x, p_y – компоненты квазиимпульса электрона в плоскости СС.

В приближении самосогласованного поля гамильтониан взаимодействующих электронов с учетом процессов переброса по аналогии с 3D электронным газом [6] имеет вид

$$H = \sum_{\vec{p}} \varepsilon(\vec{p} - e\vec{E}t) a_{\vec{p}}^+ a_{\vec{p}} + e \frac{1}{\sqrt{N_x N_y}} \sum_{\vec{p}, \vec{k}} \sum_{n, m} U(\vec{k}, t) \times \\ \times M(k_x) M(k_y) a_{\vec{p}-\vec{k}+\vec{g}}^+ a_{\vec{p}} \quad (2)$$

где $a_{\vec{p}}^+, a_{\vec{p}}$ – операторы рождения и уничтожения электрона с импульсом \vec{p} ; N_x и N_y – число потенциальных ям, образующих СС вдоль осей x и y соответственно, $\vec{g} = (n\frac{2\pi}{d}, m\frac{2\pi}{d})$,

$$M(k_x) = \int_0^{N_x d} \varphi^*(x) \varphi(x) \exp(-ik_x x) dx \\ M(k_y) = \int_0^{N_y d} \varphi^*(y) \varphi(y) \exp(-ik_y y) dy \quad (3)$$

$U(\vec{k}, t)$ – самосогласованный потенциал, определяемый следующим соотношением

$$U(\vec{k}, t) = \frac{2\pi e^2}{\chi k} \sum_{\vec{p}, n, m} \langle a_{\vec{p}+\vec{k}+\vec{g}}^+ a_{\vec{p}} \rangle \times M(\vec{k}-\vec{k}_x) M(\vec{k}-\vec{k}_y) \quad (4)$$

χ – диэлектрическая проницаемость кристаллической решетки, угловые скобки означают усреднение по матрице плотности, соответствующей гамильтониану (2).

Решив уравнение движения в приближении случайных фаз для средних $\langle a_{\vec{p}+\vec{k}+\vec{g}}^+ a_{\vec{p}} \rangle$,

подставив в (4), после некоторых преобразований получаем уравнение, определяющее дисперсионную зависимость $\omega(k)$

$$\frac{2\pi e^2}{\chi} \Pi(\vec{k}, \omega) S(\vec{k}) = 1, \quad (5)$$

где

$$\Pi(\vec{k}, \omega) = \sum_{\vec{p}} \sum_{l=1}^2 \left(\frac{\Delta}{\Omega} \operatorname{str} \left[\frac{k d}{2} \right] \right) \frac{n_{\vec{p}+\vec{k}} - n_{\vec{p}}}{\varepsilon(\vec{p}_y + k_y) - \varepsilon(\vec{p}_y) - \omega + i\Omega}$$

функция $S(k)$ зависит от выбора вида волновой функции электрона в минизоне проводимости.

Вычисление поляризационного оператора значительно упрощается в случае высоких температур: $\Delta \ll T$ (T – температура в энергетических единицах).

Приведем полученные результаты для одного из случаев, а именно, для $\Omega \gg \Delta \sin(k_y d/2)$, $\Omega \gg \omega$, $k_y d \ll 1$ ($E \parallel OX$). В этом случае закон дисперсии имеет вид

$$\omega = V_m k_x \frac{F(k, \Omega)}{\sqrt{2F(k, \Omega) - 1}}, \quad (6)$$

где $F(k, \Omega) = 1 + q^2 J_0^2(Z) S(k)/2$, $Z = \Delta/\Omega \sin|k_x d/2|$

Ω – штарковская частота, $v_m = \Delta d/2$ – характерная скорость электронов в сверхструктуре, $q = (4\pi e^2 N_0 / \chi T)^{1/2}$ –

величина, обратная дебаевскому радиусу.

Из (6) следует, что частота плазмонов в сильном электрическом поле зависит от величины напряженности поля осциллирующим образом. Аналогичный результат был получен [6] для плазменных колебаний в одномерной сверхрешетке в присутствии сильного электрического поля. В обоих случаях осцилляции связаны с геометрическим резонансом между длиной волны плазмона и амплитудой штарковских колебаний электрона в сильном электрическом поле. На рисунке 1 приведен график зависимости $\omega(k_x)$, полученный с помощью численного анализа.

В рассмотренном выше приближении ($\Omega \gg \Delta \sin(k_y d/2)$) отсутствует затухание Ландау.

Отметим, что затухание возможно лишь в том случае, когда частота плазменных волн ω удовлетворяет условию

$$m\Omega - \Delta \sin\left|\frac{k_y d}{2}\right| < \omega < m\Omega + \Delta \sin\left|\frac{k_y d}{2}\right|. \quad (7)$$

При иных значениях ω и k затухание отсутствует, что следует из анализа законов сохранения энергии и квазиимпульса.

INFLUENCE OF A STRONG ELECTRIC FIELD ON PLASMA WAVES IN 2D SUPERSTRUCTURES

S.Y. Glazov, S.V. Kruchkov

Volgograd state Pedagogical university, 400131, Volgograd, Lenin pr., 27, 72-22-21

The effect of a high constant electric field on plasma oscillations in the two-dimensional electron gas of a semiconductor with a superstructure was studied taking into account the Umklapp processes. A dispersion relation for the plasma-oscillation frequency $\omega(k)$ was derived for high temperatures ($\Delta \ll T$, where Δ is the conduction miniband width and T is the temperature in energy units). The plasmon frequency in a high electric field is shown to oscillate as the electric field strength and the wave number k vary. Numerical estimates show that the oscillations may manifest themselves at electric field strengths higher than 3×10^3 V/cm.

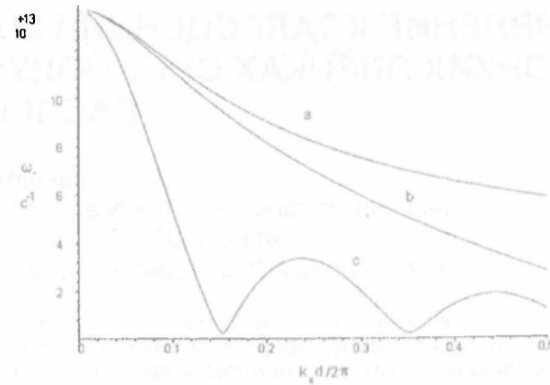


Рис.1. Зависимость $\omega(k_x)$ при концентрации $N_0 = 10^{11} \text{ см}^{-2}$, $d = 10^{-5} \text{ см}$, $\Delta = 10^{-2} \text{ eV}$, $k_y \approx 10^4 \text{ см}^{-1}$
а) $\Delta/\Omega \approx 0.1$; б) $\Delta/\Omega \approx 1$; в) $\Delta/\Omega \approx 10$

Заключение

В 2D электронном газе в системе с периодическим потенциалом в сильном электрическом поле частота плазмонов зависит от величины напряженности поля и волнового числа осциллирующим образом.

Для проявления осцилляционной зависимости $\omega(k_x)$, как следует из (6), необходимо чтобы аргумент функции Бесселя Z был бы по крайней мере больше Z_0 ($Z_0 \approx 2.41$ – наименьший корень функции Бесселя). Первый минимум при $\Delta = 10^{-2} \text{ eV}$, $k_x \approx 8 \times 10^4 \text{ см}^{-1}$ должен наблюдаться при $E = 3 \times 10^3 \text{ В/см}$.

Список литературы

1. Быков А.А., Гусев Г.М., Квон З.Д. и др. // Письма в ЖЭТФ. - 1991. - Т.53. - №8. - с. 407 - 408.
2. Гусев Г.М., Квон З.Д., Бесман В.Б. и др. // ФТП. - 1992. - Т.26. - № 3. - С. 539 - 542.
3. Крючков С.В., Шаповалов А.И. // ФТТ. - 1997. - Т.39. - № 8. - С. 1470 - 1473.
4. Глазов С.Ю., Крючков С.В. // ФТТ. - 2000. - Т.34. - № 7. - С. 835 - 837.
5. Яковлев В.А. // ФТТ. - 1961. - Т.3. - № 7. - С. 1983 - 1986.
6. Эпштейн Э.М. // ФТТ. - 1979. - Т.21. - № 6. С. 1719 - 1722.